

800V 2A

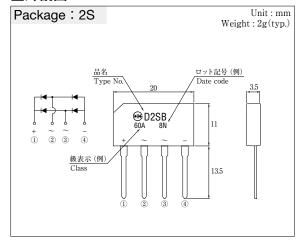
特 長

- ・薄型 SIP パッケージ
- •高IFSM

Feature

- Thin-SIP
- Large IFSM

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tl = 25℃ / unless otherwise specified)

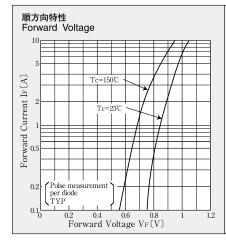
項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	品 名 Type No.	D2SB60A	D2SB80A	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-40~150		~150	$^{\circ}$	
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150		$^{\circ}$ C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	Vrm			600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波,抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T/=115℃	2		A
			Ta = 25℃	1.5		
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波,非繰り返し 1 サイクルせん頭値,Tj = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value,Tj = 25℃		120		A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I²t	lms≦t<10ms,Tj=25℃, 1素子当たりの規格値 per diode		60		A²s

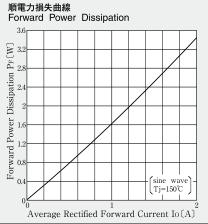
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tl = 25℃ / unless otherwise specified)

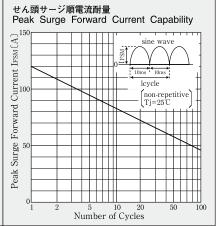
順電圧 Forward Voltage	VF	IF=1A, パルス測定, 1素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.95	V
逆電流 Reverse Current	IR	$V_R = V_{RM}$,パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μΑ
熱抵抗 Thermal Resistance	θ j l	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 10	°C/W
	θ ja	接合部·周囲間 Junction to Ambient	MAX 47	

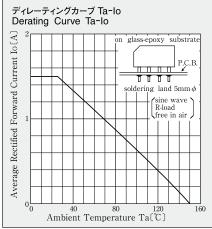
Thin SIP Bridge D2SB A

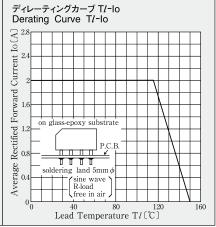
■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS











^{*} Sine wave は 50Hz で測定しています。

^{* 50}Hz sine wave is used for measurements.

^{*}半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。

Typical は統計的な実力を表しています。

^{*} Semiconductor products generally have characterristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.